

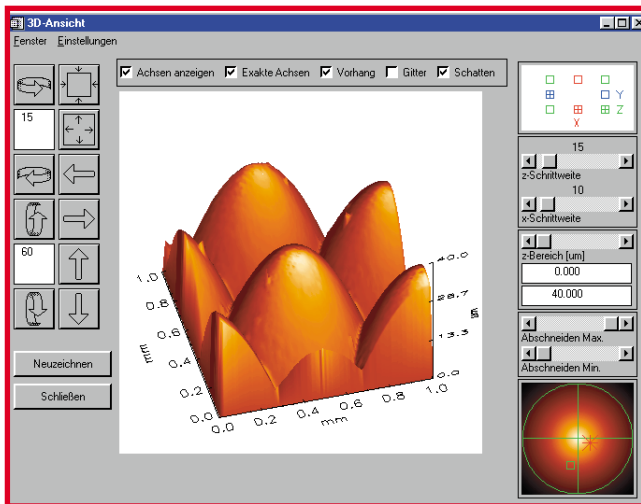
Topografie-Analyse

Precitec Optronik Mark III

Topografie, Kontur, Rauheit, Form, Schichtdicke

Precitec Mark III ist eine universelle Software zur Analyse von Topografie- und Profildaten. Wegen seiner umfangreichen Analyse-Funktionen und der hohen Benutzerfreundlichkeit setzen wir das Programm in unseren Messsystemen ein. Precitec Mark III unterstützt zudem die Dateiformate einer großen Zahl von Rastersondenmikroskopen und Profilometern.

Mit dem Programm können Abstände und Winkel gemessen, Höhenverteilungen und Traglastkurven ermittelt und Rauheits- und Welligkeitswerte bestimmt werden. Die Funktion "Dynamisches Profil" errechnet in Echtzeit vertikale und horizontale Profilschnitte durch den aufgenommenen Oberflächenbereich jeweils an der Mausposition. Durch die gemessenen Topografien können beliebige Schnittlinien gelegt werden. An die Profile längs dieser Schnittlinien können Polynome oder eine Asphärenfunktion gefittet werden.

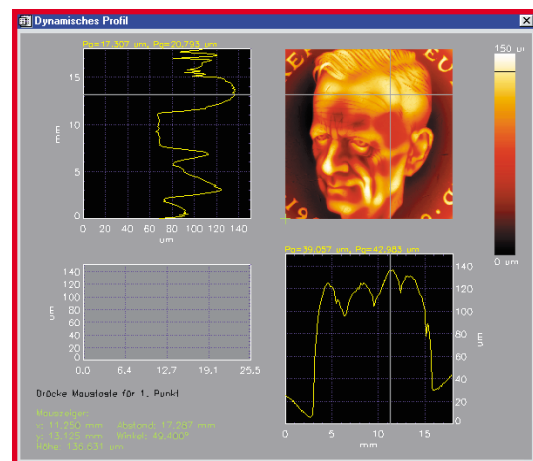


3D-Ansicht eines Mikrolinsen-Arrays

Es stehen 6 Bildspeicher zur Verfügung, die die arithmetische Verknüpfung von Daten ermöglichen (z. B. die Subtraktion von zwei Bildern). Das Programm verfügt über eine Stapelverarbeitungsfunktion, mit der die wiederholte Abfolge von bestimmten Analyseschritten vereinfacht wird. Diagramme, die die Ergebnisse einer Analyse zeigen, können mit dem Programm beschriftet und in verschiedenen Graphikformaten exportiert werden.

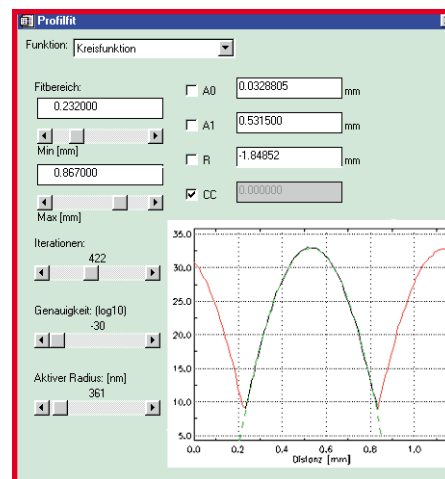
Precitec Mark III läuft unter Windows.

Das Programm ist das ideale Werkzeug zur Auswertung von Topografiedaten vieler kommerzieller Oberflächenmessgeräte.



Dynamisches Profil (2 DM-Münze)

Die Funktion „3D-Ansicht“ ermöglicht eine flexible perspektivische Darstellung der gemessenen Topografie. Feine Strukturdetails können durch eine virtuelle Lichtquelle hervorgehoben werden.



Kreisfit an einem Mikrolinsenprofil

Precitec Optronik Mark III

*Kompetenz in der berührungslosen Messtechnik
Aufbau von kompletten Prüfsystemen*

Funktionsumfang

Dateiformate

- ASCII, Burleigh, Digital Instruments, FRT, Hommelwerke, Perthometer, PSI, RM600, SIS, Veeco und weitere Formate werden unterstützt
- Import von TIFF-, GIF-, BMP- oder JPEG-Dateien
- Exportieren von Diagrammen als BMP(8Bit)-, GIF-, TIFF- oder JPEG-Datei für die Erstellung von Dokumentationen

Ansichten

- vielseitige 3D-Ansicht
 - Gitternetzmodell
 - virtuelle Lichtquelle
- 2D-Draufsicht
- beliebige Profilschnitte
- Dynamisches Profil
- Zoomfunktion zur Bereichsauswahl
- große Anzahl von Farbtabelle
- Skalierungsfunktionen
- Beschriftung der Diagramme

Filter-Funktionen

- Glättungsfilter, Medianfilter
- Sobel-, Robertsoperator zur Kantenverstärkung
- Ableitung
- Filter im Fourierraum
- Spikes entfernen
- Korrektur ungültiger Daten

Modifikations-Funktionen

- Subtraktion von Linien und Ebenen
 - Polynom 0. - 6. Ordnung
 - 3-Punkte Ebenensubtraktion
 - linienweise / spaltenweise Subtraktion
- Linien- und Spaltenmodifikation
 - Mitteln
 - Ersetzen
- benutzerdefinierte arithmetische Funktionen

Analyse-Funktion

- Messung von
 - Flächen, Volumina
 - Abständen, Winkeln
- Bestimmung von Rauheit und Welligkeit nach DIN / ISO
- Bestimmung der Motif-Rauheitswerte
- Fitfunktionen
 - Polynom 6. und 12. Ordnung
 - Asphärenfunktion
 - Kreisfunktion
- Ermittlung von
 - Histogramm (Höhenverteilung)
 - Traglastkurve
 - Korngröße

Minimale Systemanforderungen

- IBM kompatibler PC
- Windows 95 / 98
- 16 MB RAM (32 MB empfohlen)
- Bildschirmauflösung 800 x 600 (empfohlen 1024 x 768)
- Parallelport LPT 1

Lieferumfang

- Installationsmedien (CD-ROM oder 1,44 MB Disketten)
- Handbuch (deutsch / englisch)
- Hardware-Key (Dongle)